

phelos

角度相关发光光谱仪



光致发光光谱

电致发光光谱

角度相关性

发射器方向和位置

www.fluxim.com

 swiss made software



角度相关PL&EL测角光谱仪

Phelos是角度相关发光光谱仪，用于表征不同发射角和偏振角下的发光器件和薄膜。

传统的测角仪器主要集中在电致发光（EL）或光致发光（PL）上，而Phelos将这两种测量技术结合在一个桌面紧凑型仪器中。

Phelos优势

有机、量子点和钙钛矿发光薄膜在不同发射角和偏振角下的光致发光（PL）光谱。

在有机发光器件和其他发光器件上对s,p偏振方向的电致发光（EL）光谱研究。

能表征薄膜太阳能电池入射角相关光电流。

综合后处理，以确定偶极子方向和EQE。

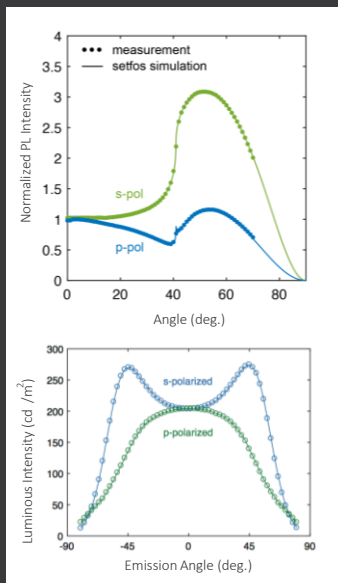
能与任何几何形状的样品灵活接触并轻松与样品对齐。

与顶部和底部发光二极管兼容。

利用集成的SMU获取电流电压亮度（IVL）曲线。



发射器方向和位置



描述单个薄膜或工作装置的特性。

结合实验和模拟来分析设备的内部操作。

利用集成光学微腔发射模型模拟测量结果。

确定发射层中偶极子发射的位置，以及偶极子的方向。

通过实验和模拟相结合的方法提取出发射层内部的复合/发射区。

Phelos由功能强大的Characterization Suite软件控制，该软件可以轻松地与Fluxim的仿真软件Setfos连接，用于数据分析、参数提取和设备建模。

测量物理量

研究主客体系统，观察纯发射极薄膜和稀释系统的发射极取向。

研究量子点下转换和散射层。

色温，CIE图，峰值波长，积分辐射...

光谱和颜色与发射角的关系。

效率：Im/W、cd/A、EQE。

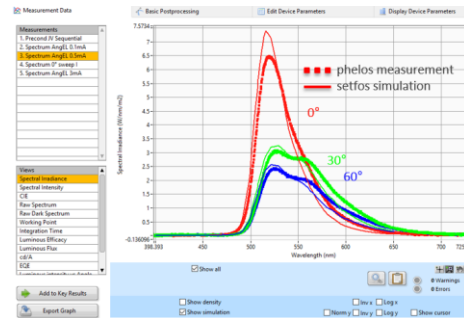


phelos

角度相关发光光谱仪

FLUXiM

一体化仿真



Setfos偶极子发射和漂移扩散模型可以直接从Phelos控制界面运行GUI* 仿真结果可导出用于离线设备优化。

* 需要Setfos许可证

Phelos 技术参数

角度范围	-85° to +85°
光学像素	< 0.5°
光谱范围	360 to 1100 nm*
光谱分辨率	2.5 nm FWHM
电压范围	± 20 V
电流范围	± 120 mA
最小可分辨电流	< 100 pA
电动偏振器	0 to 360° (continuous)
样品格面积	40 x 40 mm ²
光致发光激发谱	275 nm to 405 nm (365 nm default)
光致发电照明光斑尺寸	5 x 3 mm ²
尺寸 / 重量	52 x 29 x 24 cm / 18kg

技术支持

每次购买Phelos都会提供全面的技术支持。

今天联系我们，讨论Phelos如何推进您的研发。

hardware@fluxim.com



* 其余光谱波长范围也可提供选择。

Trusted by Academics & Industry



Katharina-Sulzer-Platz 2, CH-8400 Winterthur, Switzerland +41 44 500 47 70 info@fluxim.com